

Nutzungsordnung für Röntgenmikroskop ZEISS Xradia 520 Versa

1. Grundlegendes

Diese Nutzungsordnung bezieht sich auf das Röntgenmikroskop, nachfolgend XRM, ZEISS Xradia 520 Versa (Seriennummer 8802030311), welches im Materialwissenschaftliches Zentrum für Energiesysteme (MZE, Geb. 30.48, Raum -101) aufgestellt ist. Die vorliegende Nutzungsordnung bestimmt die Regelung zur Nutzung des XRM einschließlich der Steuer- und Auswerterechner. Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass die XRM-Gerätenutzung ausschließlich im Rahmen von Projekten erfolgen darf, die den Voraussetzungen für eine Anerkennung als gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung entsprechen bzw. dem hoheitlichen Bereich zuzuordnen sind. Diese Betreibervereinbarung ist für alle Nutzer verbindlich und wird durch Unterschrift der Nutzungsordnung anerkannt.

2. Betreiber und Geräteverantwortliche

Die Betreiber des XRM sind die Institute:

- Institut für Angewandte Materialien - Werkstoffe der Elektrotechnik (IAM-WET)
- Institut für Angewandte Materialien - Keramische Werkstoffe und Technologien (IAM-KWT)
- Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik - Verfahrenstechnische Maschinen (MVM-VM).

3. Gerätenutzung

Eine Nutzung des XRM ohne die im Folgenden genannten Einweisungen und Belehrungen ist nicht zulässig. Vor einer Nutzung bedarf es einer personenbezogenen, nicht übertragbaren Genehmigung durch einen der Betreiber (Institutsleitung), einer Strahlenschutz- und Sicherheitsbelehrung für das XRM sowie einer ausführlichen Einweisung in die Bedienung des Geräts und des Zubehörs durch einen der Geräteverantwortlichen. Eine ausführliche Einweisung in die Bedienung des Gerätes kann auch durch eine personenbezogene, nachzuweisende XRM-Geräteschulung durch den Hersteller Zeiss erfolgen.

Voraussetzung für die Selbstnutzung ist ferner die Teilnahme an der allgemeinen Sicherheitsunterweisung für Arbeiten im Labor und die Anerkennung und Einhaltung der Allgemeinen Laborordnung des KIT (der

Nachweis obliegt dem Institut, dem der Selbstnutzer angehört). Ein Geräteverantwortlicher muss bei Nutzung des Gerätes durch einen Nutzer anwesend oder erreichbar sein, die Erreichbarkeit muss vor Aufnahme der Messung durch den Nutzer sichergestellt sein. Die Geräteverantwortlichen werden durch die Betreiber benannt.

Das XRM und dessen Zubehör sind sensible Präzisionsbauteile, die mit äußerster Sorgfalt zu behandeln sind. Die Räume und Arbeitsplätze sind sauber und aufgeräumt zu hinterlassen. Weisungen von autorisierten Personen (Geräteverantwortliche, Strahlenschutz- und Sicherheitsbeauftragte) ist stets Folge zu leisten. Versuchsmaterialien, von denen Sicherheitsrisiken ausgehen könnten, dürfen nicht ohne vorherige Rücksprache mit den Geräteverantwortlichen in die Einrichtung gebracht werden. Alle betroffenen Nutzer des XRM müssen über die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen in Kenntnis gesetzt werden. Etwaige Defekte, Beschädigungen oder Ähnliches sind unverzüglich den Geräteverantwortlichen zu melden. Den Benutzern ist es nicht erlaubt, ohne Einwilligung des zuständigen Geräteverantwortlichen Eingriffe in die Hard- und Software-Installation vorzunehmen oder die Konfiguration des Gerätes zu verändern. Für selbstverschuldete Geräteschäden aufgrund einer Fehlbedienung, Fahrlässigkeit, etc. haftet der Gerätenuutzer.

4. Messzeitvergabe

Die Aufteilung von Messzeiten erfolgt in Absprache zwischen Interessenten und den Geräteverantwortlichen über einen elektronischen Kalender, der vom IAM-WET geführt wird. Interne Forschungsarbeiten haben dabei Vorrang vor externen Messungen. Die Abarbeitung der Anfragen erfolgt dabei entsprechend der zeitlichen Abfolge und kann im Bedarfsfall an spezielle Erfordernisse einvernehmlich mit allen Beteiligten angepasst werden. Im Konfliktfall entscheiden die Institutsleiter. Änderungen der geplanten Messzeiten müssen mindestens zwei Tage vor dem ursprünglich vereinbarten Termin schriftlich (E-Mail) an die jeweilig zuständigen Geräteverantwortlichen mitgeteilt werden, andernfalls erfolgt die volle Berechnung.

5. Nutzungskosten

Für die Nutzung des Großgerätes entstehen Nutzungsgebühren für den projektspezifischen Aufwand. Über eine Nutzungspauschale von € 7.500,- wird eine Gerätenutzung von 10 Tagen im Jahr gewährt. Der Tagessatz für die Nutzung des XRM beträgt 750,- € / Tag. Der Kostenansatz für das Röntgenmikroskop Xradia 520 Versa orientiert sich an den DFG-Kostensätzen für Elektronenmikroskopie der Geräteklasse II (FIB, TEM, Mikrosonde) nach DFG-Vordruck 55.04 – 06/16. Für eine Tagesnutzung werden 10 h à €75,- zugrunde gelegt. Ein Messtag bezieht sich dabei auf die Zeitspanne von 9 Uhr des Messtages bis 9 Uhr des Folgetages. Die Nutzungsdauer des XRM wird dem Geräteprotokoll und dem Buchungskalender basierend auf Nutzungstagen abgeleitet. Messzeiten, die im Rahmen von Wartungs-, Service und Kalibrierarbeiten anfallen, fließen nicht in die Nutzungsdauerberechnung ein. Alle das XRM betreffenden Kosten werden über das PSP-Element 02043700051 abgerechnet.

6. Umgang mit Daten

Der Umgang mit den Messdaten erfolgt generell streng vertraulich. Der Nutzer verpflichtet sich, nach durchgeführten Messungen die erarbeiteten elektronischen Daten auf von ihm bereitgestellten, geeigneten Datenträgern an sich zu nehmen. Für die Archivierung ist der Nutzer gemäß den gesetzlichen Bestimmungen selbst verantwortlich, ein zentrales Backup der XRM-Messdaten gibt es nicht. Im Falle der Verwendung der generierten Daten für Veröffentlichungen aller Art sind diese hinsichtlich ihres Ursprungs bzw. Urhebers eindeutig zu kennzeichnen.

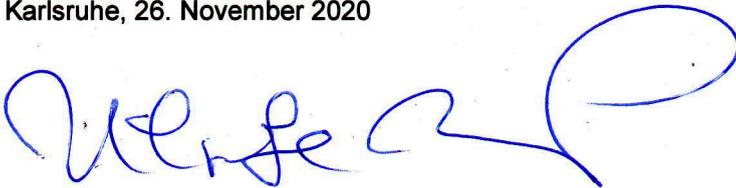
7. Haftungsausschluss

Das KIT, die Betreiber (Institute) und der Geräteverantwortliche haften nicht für Schäden gleich welcher Art, die den Benutzern aus der Inanspruchnahme der Gerätenutzung bzw. damit verbundenen Serviceleistungen entstehen.

8. Gültigkeit

Diese Nutzerordnung ist für alle Nutzer des Geräts verbindlich. Sie tritt mit der Unterschrift der verantwortlichen Leitenden ab Unterschriftsdatum bis zu einer Neuauflage in Kraft.

Karlsruhe, 26. November 2020



(Prof. Dr.-Ing. Ulrike Krewer, IAM-WET)



(Prof. Dr. Michael J. Hoffmann, IAM-KWT)



(Prof. Dr.-Ing. Hermann Nirschl, MVM-VM)